

用語に関するMMCテクニカルレポートをIECへ提案

当センターでは、10年間に亘り産技プロジェクト「マイクロマシン技術の研究開発」を行ってきましたが、このプロジェクトを推進するのと平行して、研究段階にあっても用語と計測評価法の標準化は重要なものと考えました。そこで標準化委員会（委員長：佐藤壽芳中央大学教授）の下に計測評価法WGと専門用語WGを組織しそれぞれの課題に対して調査研究を行ってきました。その成果はテクニカルレポートとしてまとめられ、すでに公表されています。用語については220語について英文と和文の定義文を作成しました。この用語集に関してはセンターが中心となって活動している、インターネット上のInternational Standardization Forumで議論を行なうとともに、用語集をホームページに掲載してその内容についてコメントを収集してきました。

その結果、ほぼ意見が出尽くしたと判断できるまでになりましたので、専門用語WGの委員の賛同を得て正式にIECに提案することとし、関係委員会のTC47（半導体デバイス）の国内委員会（JEITA）の了承を得て、正式にIEC/TC47/WG4に提案しました。

下図は用語と定義に関して日本から提案のあったことを7月5日付けで各国に周知するIECの通知書です。これからわかるように10月4

日までにこの提案を採択するかどうかの投票を、Pメンバーに対して促しています。ここで採択されればこの提案が国際標準の議論の俎板に乗ることになりますが、最終的な規格化までにはまだまだいくつかの関門があります。

しかしこのことにより当センターの標準化事業はまさに国際標準化のフェーズに入ったことになり、一つのマイルストーンを越えたと言えます。一方、これに引き続くものとして、NEDO委託で実施した薄膜の引っ張り試験方法に関して、今年度より日本規格協会の支援により標準化案の作成に取りかかる段階になっています。

なお、用語の作成に御尽力いただいた委員（所属：委員会活動時）は以下のとおりです。

委員長

諸貫信行（都立大学大学院）

委員


壁井信之（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

池田正哲（オムロン）

鈴森康一（東芝）

成宮 宏（三菱電機）

椋島武文（安川電機）

	47/1644/NP NEW WORK ITEM PROPOSAL	
	Proposer Japan	Date of proposal 2002-07
Classification according to IEC Directives Supplement, Table 1 A3	TC/SC 47	Secretariat Korea
	Date of circulation 2002-07-05	Closing date for voting 2002-10-04
<small>A proposal for a new work item within the scope of an existing technical committee or subcommittee shall be submitted to the Central Office. The proposal will be distributed to the P-members of the technical committee or subcommittee for voting, and to the O-members for information. The proposer may be a National Committee of the IEC, the secretariat itself, another technical committee or subcommittee, an organization in liaison, the Standardization Management Board or one of the advisory committees, or the General Secretary. Guidelines for proposing and justifying a new work item are given in ISO/IEC Directives, Part 1, Annex C (see extract overleaf). This form is not to be used for amendments or revisions to existing publications.</small>		
The proposal (to be completed by the proposer)		
Title of proposal IEC 60747 : Semiconductor devices — Part XX-1 : Micro electromechanical devices — Terms and definitions		
<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Technical Specification		
Scope (as defined in ISO/IEC Directives, Part2, 6.2.1) To provide (terms and definitions of microelectronic mechanical devices.)		
Purpose and justification , including the market relevance and relationship to Safety(Guide 104), EMC(Guide 107), Environmental aspects(Guide 109) and Quality assurance(Guide 102).(attach a separate page as annex, if necessary) In the field of micro electro-mechanical devices, many technology areas are included such as, electronics, mechanical engineering, chemistry and biology. it is desirable to construct glossary for micro electromechanical devices for convenience of end-users of the devices.		